W13 – Testowanie układów cyfrowych

Henryk Maciejewski Jarosław Sugier

Uszkodzenia i modele błędów

1. Modele błędów w układach cyfrowych

- 2. Generowanie wektorów testowych dla układów kombinacyjnych
 - Metody tablicowa
 - Metoda różnic boolowskich
 - Metoda pobudzenia ścieżek

B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKŁ.

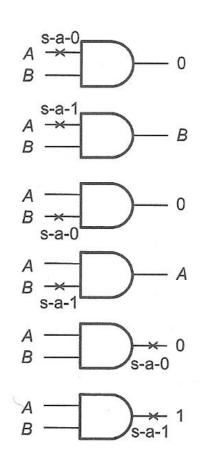
Modele błędów w układach cyfrowych

Rozważamy uszkodzenia prowadzące do <u>błędów logicznych</u> układu.

Zakładamy model: pojedynczy błąd "sklejenia":

stuck-at-0, stuct-at-1

Lokalizacje błędów: każdy sygnał wejściowy, wewnętrzny, wyjściowy



Generowanie wektorów testowych - metoda tablicowa

Rozważamy układ:

$$z = F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 x_3) \overline{(x_2 x_3 + x_4)}$$

uszkodzenie α = s-a-0 na wejściu x_4

z = wartość funkcji bez uszkodzenia

 z^{α} = wartość funkcji z uszkodzeniem α

Generowanie wektorów testowych - metoda tablicowa

Rozważamy układ:

$$z = F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2x_3)\overline{(x_2x_3 + x_4)}$$

Uszkodzenie wykrywają testy:

$$x^{1} = (1,0,0,1) = x_{1} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} x_{4}$$

 $x^{2} = (1,0,1,1) = x_{1} \overline{x_{2}} x_{3} x_{4}$
 $x^{3} = (1,1,0,1) = x_{1} x_{2} \overline{x_{3}} x_{4}$

x1	x2	х3	х4	Z	z^{α}	xor(z, z ^α)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Metoda różnic boolowskich (*boolean* difference)

Różnica boolowska funkcji $F(x_1, x_2, ..., x_n)$ wzgl. zmiennej $x_j, 1 \le j \le n$:

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} = F(x_1, x_2, \dots, 0, \dots, x_n) \oplus F(x_1, x_2, \dots, 1, \dots, x_n) = F_{\overline{x_j}} \oplus F_{x_j}$$

- Funkcja n-1 zmiennych
- $\frac{\partial F}{\partial x_j} = 1$ \rightarrow dla danego wektora wejściowego $(x_i, i \neq j)$ wartość F zależy od zmiennej x_i
- $\frac{\partial F}{\partial x_j} = 0$ \rightarrow dla danego wektora wejściowego $(x_i, i \neq j)$ wartość F <u>nie</u> zależy od x_j

Metoda różnic boolowskich (*boolean* difference)

Poprzedni przykład: $z = F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2x_3)\overline{(x_2x_3 + x_4)}$

$$F_{x_4} = (x_1 + x_2 x_3) \overline{(x_2 x_3 + 1)} = 0$$

$$F_{\overline{x_4}} = (x_1 + x_2 x_3) \overline{(x_2 x_3 + 0)} = (x_1 + x_2 x_3) \overline{x_2 x_3} = x_1 \overline{x_2 x_3}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_4} = F_{\overline{x_4}} \oplus F_{x_4} = x_1 \overline{x_2 x_3}$$

ightarrow stąd wektory testowe, uwzględniając warunek, aby x_4 odróżniało się od uszkodzenia α

Wynik metody tablicowej:

$$x^{1} = (1,0,0,1) = x_{1} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} x_{4}$$

 $x^{2} = (1,0,1,1) = x_{1} \overline{x_{2}} x_{3} x_{4}$
 $x^{3} = (1,1,0,1) = x_{1} x_{2} \overline{x_{3}} x_{4}$

$$\frac{\partial F}{\partial x_4} = F_{\overline{x_4}} \oplus F_{x_4} = x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} = x_1 (\overline{x_2} + \overline{x_3}) = x_1 \overline{x_2} (x_3 + \overline{x_3}) + x_1 \overline{x_3} (x_2 + \overline{x_2})$$

$$= x_1 \overline{x_2} x_3 + x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} + x_1 x_2 \overline{x_3}$$

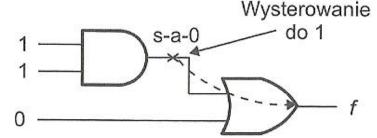
stąd wektory testowe (przy x_4 = 1, aby odróżniało się od uszkodzenia α) $x^1 = x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 = (1,0,0,1)$ $x^2 = x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 = (1,0,1,1)$ $x^3 = x_1 x_2 \overline{x_3} x_4 = (1,1,0,1)$

Wektory testowe dla błędów @ x_i uzyskuje się jako:

$$x_j \frac{\partial F}{\partial x_j}$$
 dla s-a-0 $\overline{x_j} \frac{\partial F}{\partial x_j}$ dla s-a-1

Metoda pobudzenia ścieżek (path sensitization)

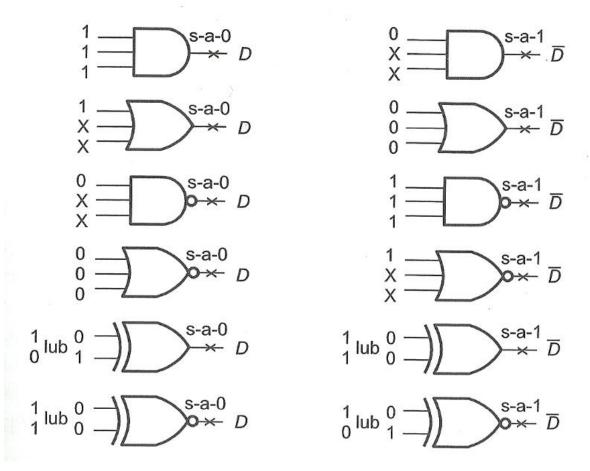
Test = activate + propagate



Activate: wymuszamy w danym punkcie układu wartość przeciwną do błędu badanego w tym punkcie (np. wymuszamy 1, gdy badamy s-a-0)

<u>Propagate</u>: ustawiamy wartości sygnałów na pozostałych bramkach w układzie tak żeby spowodować propagację sygnału błędu (sygnału D / \overline{D}) do zewnętrznego wyjścia układu.

Aktywowanie podstawowych bramek

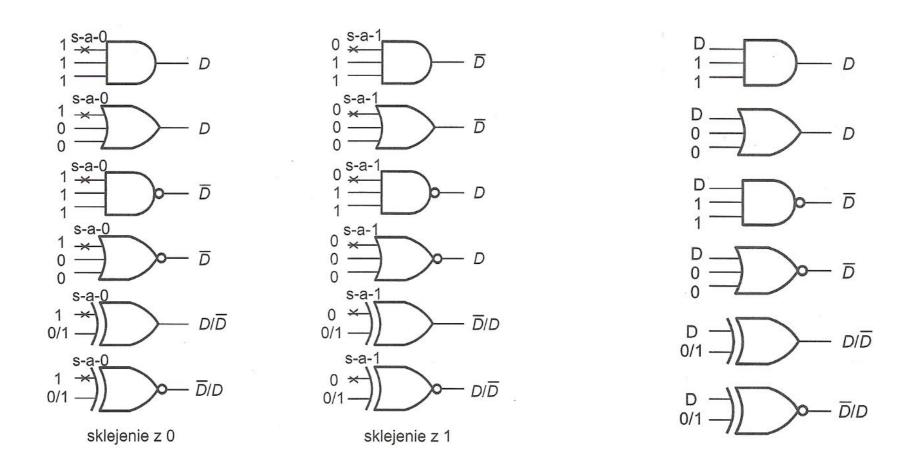


Symbol D:

D: sygnał przy niewystępowaniu błędu ma mieć wartość 1

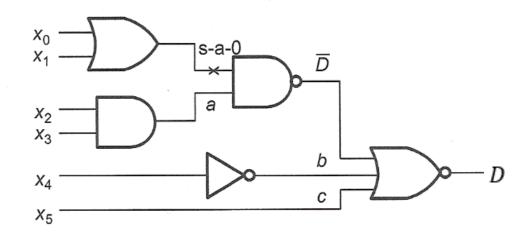
 \overline{D} : sygnał przy niewystępowaniu błędu ma mieć wartość 0

Propagowanie sygnału D / \overline{D} do wyjścia układu



Bramki XOR i XNOR zawsze propagują D (jako D albo \overline{D})

Przykład



Activate

$$x_0 + x_1 = 1 \rightarrow x_0, x_1 \in \{01, 10, 11\}$$

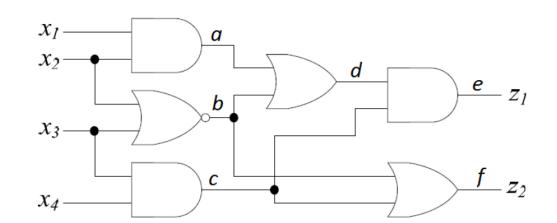
Propagate

$$a = x_2 \cdot x_3 = 1$$
 $x_2 = x_3 = 1$
 $b = 0$ $x_4 = 1$
 $c = 0$ $x_5 = 0$

Stąd zbiór testów wykrywających uszkodzenie:



s-a-0 @ b



Activate

$$b = \overline{x_2 + x_3} = 1 \rightarrow$$

$$x_2 = x_3 = 0$$

Propagate – ścieżka do z₁

$$a = 0 = x_1 \cdot x_2$$

$$x_1 x_2 \in \{00,01,10\}$$

$$c = 1 = x_3 \cdot x_4$$

$$x_3 = 1, x_4 = 1$$

Sprzeczność: $x_3 = 0$ i $x_3 = 1$ \rightarrow błąd nie może być wykryty na wy z_1

Propagate – ścieżka do z₂

$$c = 0 = x_3 \cdot x_4$$

$$x_3 x_4 \in \{00,01,10\}$$

Zbiór testów wykrywających uszkodzenie:

Błędy równoważne w bramce

Błędy równoważne – wykrywane przez te same wektory testowe (zbiory wektorów testowych wykrywających każdy z błędów równoważnych są równe)

<u>Przykład – bramka OR:</u>

Błąd s-a-1 na każdym z wejściu – testuje wektor 000

0 *-a-1 \overline{D}

Błędy s-a-1 na każdym z wejść - równoważne

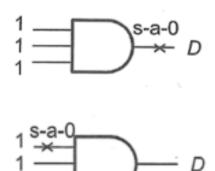
Wektor 000 testuje też błąd s-a-1 na wyjściu

0
0
0
0
**
$$\bar{D}$$

Błędy s-a-1 na każdym z wejść i na wyjściu – równoważne (nierozróżnialne)

Przykład – bramka AND:

Błędy s-a-0 na każdym z wejść i na wyjściu – równoważne (nierozróżnialne)

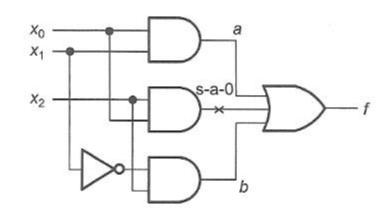


? Błędy równoważne dla bramki NAND i NOR ?



Błędy niewykrywalne

W tym przykładowym układzie błąd s-a-0 jest niewykrywalny (dlaczego?)



Przyczyną niewykrywalnych błędów (pojedynczych) jest nadmiarowość w układzie

Zminimalizowana postać układu – nie ma błędów niewykrywalnych:

$$f = x_0 x_1 + \overline{x_1} x_2$$

Realizacja układów nieuproszczonych czasami konieczna (eliminacja hazardów, korzystanie z określonego typu bramek – np. dwuwejściowych) → stosuj dodatkowe wyjścia - wyprowadzenia punktów wewnętrznych (dla testowalności)